

「TIA 光量子計測セミナー」のお知らせ

KEK 測定器開発室では、以下のセミナーを企画しております。

画素内に独立した APD 内蔵した超高感度イメージセンサーを開発しているパナソニック株式会社から、報告をしていただけることになりました。

日時：2018 年 10 月 5 日（金曜日）13:30～15:00

会場：高エネルギー加速器研究機構 4 号館 3 階輪講室 ([交通アクセス](#))

題 目：「アバランシェフォトダイオードを画素に有する CIS の最新の開発成果（TOF-測距システムへの応用を例として）」

講 師：廣瀬 裕氏（パナソニック株式会社 A I S 社 技術本部 センシングソリューション開発センター 主幹技師）

Abstract: アバランシェフォトダイオードを画素に有する CIS の初期のデバイス開発（2016ISSCC）から 2018VLSI Symposium で報告した最新のセンサ技術とそれを応用した長距離（250m）測距システムについて紹介する。

TV 会議による遠隔からの接続も予定しておりますので、奮ってご参加ください。

問い合わせ：KEK 測定器開発室 幅 淳二

